

Программа Объединённой конференции «Электронно- лучевые технологии и рентгеновская оптика в микроэлектронике» - КЭЛТ-2021

13 сентября, понедельник

Открытие Конференции 13:50 Вступительное слово –Рощупкин Д.В.

Устные доклады секции 1. Диагностика полупроводниковых материалов и структур

Якимов Е. Е., ИПТМ РАН	Расширение дефектов упаковки в 4H-SiC при облучении электронным пучком	14:00-14:25
Вергелес П. С., ИПТМ РАН	Исследование свойств дислокаций в GaN методом катодolumинисценции ВРЭМ	14:25-14:50
Дементьева Е. В., ФТИ им. А.Ф. Иоффе	Определения типа и концентрации ловушек в тонких слоях HfO ₂ .	14:50-15:15

Устные доклады секции 4. Электронно-лучевая и ионная литографии

Асадчиков В. Е., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Микроструктуры на основе регулярных трековых мембран и их нелинейно- оптическая диагностика	15:15-15:40
--	---	-------------

Перерыв 20 мин.

Артемов В. В., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Ионная литография кремниевых Фурье- метаповерхностей для оптического диапазона	16:00-16:25
Медведская П. Н., БФУ им. И. Канта	Ионно-лучевая литография для приложений когерентной рентгеновской оптики	16:25-16:50
Казмирук В. В., ФГБУН ИПТМ РАН	Выбор оптимальной стратегии электронного экспонирования шаблонов структур КМОП СБИС с технологической нормой 65 нм	16:50-17:15
Загорский Д. Л., ИК РАН	Микроскопия в исследовании нанопроволок различных типов	17:15-17:40
Миловзоров Н., TESCAN	Возможности FIB-SEM TESCAN для контроля изделий микроэлектроники	17:40-18:05

Стендовые доклады 18:10

Секция 1. Диагностика полупроводниковых материалов и структур

Секция 4. Электронно-лучевая и ионная литографии

Секция 5. Электронно-лучевые технологии в микроэлектронике

19:00 Welcome Party (Sponsored by TESCAN)

14 сентября, вторник

Устные доклады секции 3. Сканирующая зондовая микроскопия и зондовая нанолитография

Чайка А. Н., ИФТТ РАН	Исследование атомной и электронной структуры функционализированного графена на пластинах β -SiC/Si(001)	9:30-9:55
Анкудинов А. В., ФТИ им. А. Ф. Иоффе	Механические испытания нанобъектов с помощью атомно-силовой микроскопии	9:55-10:20
Фомин Л. А., ИПТМ РАН	Описание толщинной зависимости рельефа поверхности эпитаксиальных пленок Mo моделью Кардара-Паризи-Жанга	10:20-10:45
Макарова И. П., ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН	Закономерные связи температурных изменений атомной, реальной структуры и свойств кристаллов-суперпротонов	10:45-11:10

Перерыв 20 мин.

Боднарчук Я. В., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Создание микродоменных структур методом атомно-силовой микроскопии в He-имплантированных оптических волноводах на LiNbO_3	11:30-11:55
Ильина М. В., ЮФУ	Характеризация электромеханических свойств ориентированных углеродных нанотрубок методами атомно-силовой микроскопии	11:55-12:20
Толстихина А. Л., ИК РАН	Микроскопия поверхности при фазовых переходах в кристаллах $(\text{NH}_4)_3\text{H}(\text{SeO}_4)_2$	12:20-12:45

Обед 12:45 – 14:00

Устные доклады секции 2. Характеризация материалов и структур методами ПЭМ и РЭМ

Суворова Е. И., ИКАН	Фазовая устойчивость нанокристаллов оксида иттрия Y_2O_3 в сверхпроводящем слое YBCO при облучении ионами ксенона.	14:00-14:25
Коплак О. В., ИПХФ РАН	Формирование высококоэрцитивных микропроводов PrDyFeCoB	14:25-14:50
Садовская Н. В., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Применение методов РЭМ и ДСК для исследования изменений надмолекулярной структуры и кристалличности фторполимеров в процессе их растворения/диспергирования в сверхкритических флюидах	14:50-15:15

Перерыв 20 мин.

Фаррахов Б. Ф., КФТИФИЦ КазНЦ РАН	Incoherent-light pulse annealing of nanoporous germanium layers formed by ion implantation	15:35-16:00
Чернышев Б. Д., АО "Спецмагнит"	Структурное исследование промышленных постоянных магнитов на основе сплавов системы самарий-кобальт	16:00-16:25
Новиков Ю. А., ФГБУН ФИЦ ИОФ РАН	От метра до нанометра	16:25-16:45
Новиков Ю. А., ФГБУН ФИЦ ИОФ РАН	Механизмы формирования изображений в РЭМ	16:45-17:05

Стендовые доклады 17:10

Секция2. Характеризация материалов и структур методами ПЭМ и РЭМ

Секция3. Сканирующая зондовая микроскопия и зондовая нанолитография

15 сентября, среда

Устные доклады секции6. Рентгеновская кристаллооптика

Рощупкин Д. В., ИПТМ РАН	Исследование распространения поверхностных и псевдоповерхностных акустических волн в кристаллах LiNbO ₃ и LiTaO ₃ методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии	9:30-9:55
Пуногов В. И., ФИЦ Коми НЦ УрО РАН	Лауэ дифракция пространственно ограниченных рентгеновских пучков в периодических структурах	9:55-10:20
Суворов Э. В., ИФТТ РАН	Особенности формирования деформационных полос в кристаллах	10:20-10:45
Смирнова И. А., ИФТТ РАН	Рентгеновский дифракционный интерферометр с одной щелью: численное моделирование и аналитика	10:45-11:10

Перерыв 20 мин.

Устные доклады секции7. Многослойная оптика для рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазона

Гарахин С. А., ИФМ РАН	Измерения абсолютных значений интенсивности излучения в диапазоне длин волн 6,6-32 нм мишени из нержавеющей стали при импульсном лазерном возбуждении	11:30-11:55
Перекалов А. А., ИФМ РАН	Исследование абсолютных интенсивностей эмиссионных линий газоструйных мишеней	11:55-12:20
Чернышев А. К., ИФМ РАН	Программа коррекции локальных ошибок формы малоразмерным ионным пучком на основе матричного алгоритма	12:20-12:45
Миловзоров Н., TESCAN	Рентгеновские томографы TESCAN	12:45-13:05

Обед 13:05 – 14:30

Устные доклады секции 6. Рентгеновская кристаллооптика

Ломов А. , ФТИАН им. К.А. Валиева РАН	Особенности диагностики термомиграционных р-каналов Si(Al) методом трехкристальной рентгеновской дифрактометрии в геометрии Брэгга	14:30-14:55
Поляков С. Н., ГНЦ РФ ТИСУМ	CVD монокристаллы алмаза высокого структурного совершенства для рентгеновской оптики	14:55-15:20
Сороковиков М. Н., ФГАОУ ВО БФУ им.И.Канта	Планарная преломляющая оптика на основе кремния для источников рентгеновского излучения: метрология	15:20-15:45

	и совершенствование методов изготовления	
Бузмаков А. В., ФНИЦ КиФ РАН	Новый метод математической реконструкции в рентгеновской микротомографии для исследования изменяющихся объектов.	15:45-16:10

Перерыв 20 мин.

Труни К. Г., ИППФ НАН РА	Динамическая дифракция плоских рентгеновских волн в кристаллах ADP под влиянием температурного градиента	16:30-16:55
Кочарян В. Р., ИППФ НАН РА	Управление параметров отраженного пучка жесткого рентгеновского излучения кристаллом кварца при наличии внешних воздействий	16:55-17:20
Аргунова Т. С., ФТИ им. А.Ф. Иоффе	Диагностика микропор в монокристаллах методом фазово-контрастного изображения в синхротронном излучении	17:20-17:45
Михайленко М. С., ИФМ РАН	Изучение ионного распыления монокристаллического кремния с целью формирования рентгенооптических элементов	17:45-18:10

Стендовые доклады 18:10

Секция 6. Рентгеновская кристаллооптика

Секция 7. Многослойная оптика для рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазона

16 сентября, четверг

Устные доклады секции 8. Применение рентгеновской оптики для исследования микро- и наноструктур

Горай Л. И., ИАП РАН	Пути использования Si-решеток-подложек с блеском для работы в различных диапазонах спектра – от экстремального ультрафиолета до жесткого рентгена	9:30-9:55
Нечай А. Н., ИФМ РАН	Импульсный жидкоструйный лазерно - плазменный источник МР и ЭУФ излучения	9:55-10:20
Фещенко Р. М., ФИАН	Параболическое уравнение в задачах рентгеновской оптики	10:20-10:45
Фоломешкин М. С., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Нанофокусировка синхротронного излучения с использованием адиабатической преломляющей линзы	10:45-11:10

Перерыв 20 мин.

Устные доклады секции 9. Рентгеновская микроскопия и томография

Асадчиков В. Е., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Многомасштабное исследование структуры полилактидов	11:30-11:55
--	---	-------------

Бушуев В. А., МГУ имени М.В. Ломоносова	Статистическая теория формирования рентгендифракционного фазового контраста	11:55-12:20
Золотов Д. А., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Новые подходы к решению задачи визуализации дефектов в монокристалле кремния по данным рентгеновской дифракционной томографии	12:20-12:45
Самохвалов С.А., ООО «Лаборатория им. В.А. Бурцева»	Настольный источник мягкого рентгеновского излучения на основе плазмы капиллярного разряда	12:45-13:05

Обед 13:05 -14:30

Устные доклады секции 10. Новые методы исследования микро- и наноструктур с использованием синхротронных и лабораторных источников рентгеновского излучения

Баранников А. , БФУ им. И.Канта	Лабораторный комплекс для тестирования рентгеновской оптики и адаптации синхротронных методов исследования.	14:30-14:55
Баулин Р. А., МГУ	Кластерно-слоистые структуры [Fe/Cr] исследуемые методами GISAXS и синхротронной мёссбауэровской рефлектометрии	14:55-15:20
Вишняков Е. А., ФИАН	MgF ₂ однолинзовый монохроматор на область спектра 115-140 нм	15:20-15:45
Кон В. Г., НИЦ КИ	Пределы нанофокусировки синхротронного излучения с помощью составной преломляющей линзы	15:45-16:10

Перерыв 20 мин.

Устные доклады секции 9. Рентгеновская микроскопия и томография

Подурец К. М., НИЦ "Курчатовский институт"	Вглубь времен с синхротронной и нейтронной визуализацией	16:30-16:55
Реунов Д. , ИФМ РАН	Высокоразрешающий зеркальный рентгеновский микроскоп на длину волны 13.88 нм.	16:55-17:20
Чукалина М. В., ФНИЦ Кристаллография и фотоника	Совмещение изображений в задаче формирования мультиспектрального изображения из полутоновых, собранных в различных экспериментальных условиях	17:20-17:45

Стендовые доклады 17:50

Секция 8. Применение рентгеновской оптики для исследования микро- и наноструктур

Секция 9. Рентгеновская микроскопия и томография

Секция 10. Новые методы исследования микро- и наноструктур с использованием синхротронных и лабораторных источников рентгеновского излучения

17 сентября, пятница

Устные доклады секции 10. Новые методы исследования микро- и наноструктур с использованием синхротронных и лабораторных источников рентгеновского излучения

Мальшев И. В., ИФМ РАН	Проект станции «Наноскопия в окне прозрачности воды» для синхротрона СКИФ	9:30-9:55
Грибов А. Н., АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ", Троицк	Рентгеновский микроскоп с высоким пространственным разрешением (≥ 2 мкм) и временным разрешением 1 нс	9:55-10:20
Некипелов С. В., ФИЦ Коми НЦ УрО РАН	Рентгеноспектральные исследования титанатов кальция-меди, допированных атомами 3d-металлов.	10:20-10:45
Петрова О. В., ФМИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН	Исследования карбонат-замещенного апатита кости методами ультрамягкой рентгеновской спектроскопии поглощения	10:45-11:10
Сивков В. Н., ФИЦ Коми НЦ УрО РАН	Исследование структуры и химического состава нанокompозитов на основе графитизированных природных материалов и углеродных нанотрубок.	11:10-11:35

Закрытие конференции

Стендовые доклады секции 1. Диагностика полупроводниковых материалов и структур

Гременок В. Ф., НПЦ НАН Беларуси по материаловедению	Preparation and characterization of ZNO films doped by Europium for solar cells
Зарецкая Е. П., ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению"	Структурные свойства пленок ZnO:Tb, осажденных золь-гель методом
Манякин М. , ФГБОУ ВО «ВГУ»	Моделирование рентгеновских фотоэлектронных спектров диоксида олова
Мехрабова М. А., Институт Радиационных Проблем НАНА	Влияние γ -излучения на морфологию поверхности эпитаксиальных пленок $Cd_{1-x}Fe_xTe^1$
Михайловский В. Ю., СПбГУ	Катодолюминесценция карбида кремния, подвергнутого детонационной обработке
Михеев Н. Н., ЛКМ ИК РАН - филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотони	Диагностика полупроводниковых материалов и структур количественными методами РЭМ: спектральной катодолюминесценции и наведенного тока
Наумов А. П., ИПТМ РАН	Пористый кремний с графеновым покрытием для хранения водорода
Пермяков Н. В., СПбГЭТУ "ЛЭТИ"	Исследование проводящих свойств тонких пленок с использованием жидких зондов на основе эвтектического раствора с возможностью варьирования размера
Саенко А. В., ЮФУ, ИНЭП	Исследование электрофизических свойств пленок ИТО для структур солнечных элементов и мемристоров
Старков В. В., ИПТМ РАН	Исследование эффекта зарядовой подкачки в ФЭП структурах
Степович М. А., КГУ им. К.Э.Циолковского	О некоторых математических моделях диффузии неравновесных неосновных носителей заряда, генерированных электронным пучком в полупроводниковой мишени
Томаев В. В., СПГТИ(ТУ)	Морфологические особенности тонких плёнок оксида цинка, обладающих интенсивной люминесценцией в зелёной области спектра
Томинов Р. В., ЮФУ	Исследование влияние легирования нанокристаллических пленок ZnO на их мемристивные свойства
Уразов К. , ИТКЭ им. Д.В. Сокольского	Электроосажденные тонкие пленки CZTSe

Хусурова Г. М., ИТКЭ им. Д.В. Сокольского	Определение состава и микроструктуры полупроводниковых электродов CuBi_2O_4 модифицированных наночастицамиPt
---	--

Стендовые доклады секции 2. Характеризация материалов и структур методами ПЭМ и РЭМ

Акберова Э. , ФГБОУ ВО ВГУ	Микроскопический анализ поверхности гетерогенных мембран с разной долей катионообменника
Акимова О. В., МГУ им. М.В. Ломоносова	Особенности изменения рельефа поверхности мембранного диффузионного фильтра в результате взаимодействия с водородом
Аксенов О. И., ИФТТ РАН	Исследование влияния структуры микропроводов на основе железа на их магнитную доменную структуру и свойства
Алекперов Э. Ш., БГУ	Фазовый переход при термообработке аморфных плёнок $\text{TlIn}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Se}_2$ полученных в электрическом поле
Бешенков В. Г., ИПТМ РАН	Сравнительное сопоставление элементного состава пленок ЦТС, осаждаемых магнетронным распылением в аргоне и ксеноне, по данным рентгеноспектрального микроанализа
Волков Р. Л., НИУ МИЭТ	Электронно-микроскопические исследования структуры и состава нанопроволок германия до и после электрохимического внедрения лития
Гелевер В.Д., Технопарк г.Санкт-Петербурга АО	Способы детектирования обратнорассеяных электронов в РЭМ
Гостева Е. А., НИТУ МИСиС	Сравнительная оценка токсичности при формировании биологических объектов на поверхности кремниевых структур
Градов О. , ФИЦ ХФ РАН	Возможно ли увеличение информативности электронно-микроскопического исследования ВТСП с помощью Y-модулированного детектирования и анализа сканограмм с использованием дискретного дифференциального оператора на свёртке сепарабельными целочисленными фильтрами?
Градов О. , ФИЦ ХФ РАН	О целесообразности применения гибридных интегральных микросхем и микросборок в качестве совместимых с ESEM микрофлюидных субкамер. Опыт аналитической утилизации гибридных топологий
Градов О. , ФИЦ ХФ РАН	К динамическому исследованию поведения фольговых тензорезисторов в режимах корреляционной световой и электронной микроскопии ("CLEM"), включая атмосферно-жидкостные техники ("ESEM") и безлинзовую CLEM
Григорьева Д. Д., НИТУ МИСиС	Микроструктура наночастиц карбида железа, полученных левитационно-струйным методом
Гусакова О. В., МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ	Влияние легирования металлами на зеренную структуру и механические свойства быстрозатвердевшего эвтектического силумина
Гусакова О. В., МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ	Образование наноразмерных частиц кремния в силуминах, легированных металлами при высокоскоростном затвердевании
Жеребцов Д. Д., ЛАМ	Снижение энергии электронов РЭМ и сглаживание рельефа микрочастиц, как методы повышения точности измерения их элементного состава
Зайцева Ю. С., НИУ МИЭТ	Зернистая структура тонких эпитаксиальных слоев $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ на подложке Si(111)
Землякова Н. , ИПМ РАН	Влияние холодного волочения на формирование субструктуры и физических свойств меди М1 после холодной РКУП
Зерница Д. А., УО МГПУ им. И.П. Шамякина	Особенности формирования микроструктуры и текстуры доэвтектического сплава Sn-4,4мас. % Zn, полученного сверхбыстрым

	затвердеванием из расплава
Зыков А. В., Национальный исследовательский университет «МИЭТ»	Зависимость матричного элемента электронов с характеристическими потерями энергии от направления вылета электрона L-оболочки атома кремния
Каптелов Е. Ю., ФТИ им. А.Ф. Иоффе	Изменение сферолитовой микроструктуры сегнетоэлектрических тонких плёнок цирконата-титаната свинца при вариации технологических параметров осаждения
Клименко И. В., ИБХФ РАН	Сравнительное исследование морфологии бескислородного графена, полученного в органической и водно-органической средах, методами ПЭМ и динамического светорассеяния
Кнотько А. В., МГУ	Исследование особенностей формирования материалов низкотемпературного твердения на основе кальций-магний аммонийных фосфатов методами РЭМ и РСМА
Кравец В. А., ФТИ им. А. Ф. Иоффе	Разработка методики оценки радиационной стойкости стекол при облучении электронами средних энергий
Ларионов Ю. В., ИОФ РАН	Ограничения для низковольтного РЭМ в нанометрологии
Лобанов Л.Н, УрФУ	Особенности расчета поСЭМ изображениям аспектного отношения и плотности интерфейса ниобиевых волокон в микрокомпозитеCu-Nb
Малышкина О. В., ТвГУ	Выявление особенностей свойств керамик твердых растворов на основе ниобатов и танталатов с помощью растрового электронного микроскопа
Мараева Е. В., СПбГЭТУ	Исследование композиционных структур на основе гидроксипатита
Маслобоева С. М., ИХТРЭМС КНЦ РАН	Исследование методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и лазерной абляцией состава и однородности шихты ниобата лития, легированной бором и синтезированной жидкофазным методом
Митина А. А., ИПТМ РАН	Формирование композиционных слоёв МУНТ/MnO ₂ на поверхности алюминиевой фольги
Митусова К. А., ИВС РАН	Стабилизация наночастиц биогенных элементов бычьим сывороточным альбумином: структура и морфология
Мотылева С. м., ФГБНУ ФНЦ Садоводства	SEM end EDX analysis for mineral inclusions in the <i>Actinidiaarguta</i>
Никулина А. А., НГТУ	Особенности строения материалов, полученных электроискровым спеканием разнородных сталей
Новиков Ю. А., ФГБУН ФИЦ ИОФ РАН	Калибровка РЭМ по двум координатам с использованием одногоаттестованного размера
Новиков Ю. А., ФГБУН ФИЦ ИОФ РАН	Измерения наРЭМ размеров рельефных структур в технологическом процессе производства микросхем
Приходько А. С., Национальный исследовательский университет "МИЭТ"	Приготовление образцов планарного сечения атомарно тонких слоев двумерных материалов со связями Ван-дер-Ваальса для электронно-микроскопических исследований
Разбицкая Л. Е., РУДН	Разработка технологии создания наноструктур на основе титана и области их применения
Садовская Н. В., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Применение методов РЭМ и РСМА для характеристики частиц приземного аэрозоля
Сазонов В. А., Национальный исследовательский университет «МИЭТ»	Применение дифракционных картин в сходящемся пучке для определения полярности образцов арсенида галлия
Соколов В. Н., МГУ	Анализ изменения формы структурных элементов при деформировании

Стебельков В. А., НП "Лаборатория анализа микрочастиц"	Применение РЭМ-РМА для совместного исследования образцов разных природы и состава
Степанцов Е. А., ИКРАН	СЭМ исследование поверхности пленки (100)YBa ₂ Cu ₃ O ₇
Сухинина Н. С., ИФТТ РАН	Необычная трансформация сферических частиц ПММА под действием электронного пучка микроскопа
Титова А. В., СПбГУ	Электронная микроскопия в палеопалинологических исследованиях
Ткачев В. В., ДВФУ	Структура сплавов типа Fe-Cu-Nb-Si-B с различной концентрацией меди
Трунькин И. Н., НИЦ КИ	Исследование Те- и Са-содержащих образований в ходе испытаний реакторных конструкционных сплавов ХН80МТЮ методами электронной микроскопии
Хантимеров С. М., КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН	Создание слоев нанопористого германия различной морфологии методом ионной имплантации для анодов литий-ионных аккумуляторов
Шепелевич В. Г., БГУ	Микроструктура и свойства быстрозатвердевших сплавов системы Al – Вi для генерирования водорода из воды
Шипко М. Н., ИГЭУ им. В.И.Ленина	О влиянии импульсов слабого магнитного поля на состояние приповерхностного слоя и электромагнитные свойства аморфных ленточных сплавов системы FeSiBLa
Шкалей И. В., ИПМех РАН	Исследование топографии и химического состава поверхности антифрикционных сплавов методом РЭМ
Щербакова Е. Н., БНТУ	Исследование нанокompозита на основе ядра из гидроксиапатита и магнетита методами сканирующей электронной микроскопии
Юшков А. А., УрФУ	Вакуумнонапыленные градиентные пленки системы Sb-Te: воздействие пучка в ПЭМ и исследования микроструктуры

Стендовые доклады секции 3. Сканирующая зондовая микроскопия и зондовая нанолитография

Авилов В. И., ЮФУ	Наномемристор на основе электрохимического оксида титана, сформированного методом зондовой литографии.
Атаханов А. А. у., ИХФП АН РУз	Структурные исследования наночастиц целлюлозы методами атомно-силовой микроскопии и рентгеноструктурного анализа
Ашуров Н. Ш., ИХФП АН РУз	Получение и исследование структурных характеристик пленок оксида титана
Баран Л. В., БГУ	Электросиловая микроскопия тонких пленок фуллерит-серебро
Валиев Х. Х., ИПРИМ РАН	Исследования эластомерных композитов с наполнителями на основе диоксида кремния
Валуева С. В., ИВС РАН	Исследование методами АСМ и ПЭМ структурно-морфологических параметров наночастиц селена и серебра, стабилизированных графт-сополимерами варьируемой топологии
Второва В. С., ГАОУ АО ДО РШТ	Разработка методики формирования элементов и устройств МЭМС на основе метода динамической силовой литографии
Губанова Г. Н., ИВС РАН	Структурно-морфологические особенности нанокompозитов на основе термостойкого полиамидоимида (ПАИ) с силикатными Na-Mg наночастицами
Дементьев П. А., ФТИ им. А.Ф.Иоффе	Математическое описание диссипации зарядов в диэлектриках
Криничная Е.П., ИБХФ РАН	Применение метода АСМ для исследования структуры композитных пленок поли- <i>n</i> -ксилитен – сульфид кадмия
Лапега А. В., НГУ	Исследование морфологии поверхности тонких плёнок AlN методом

	АСМ
Лашкова А. К., ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН	Исследование механических свойств слоистых кристаллов триглицинсульфата методом атомно-силовой спектроскопии
Морозова А. С., КФТИ им.Е.К. Завойского ФИЦ КазНЦ РАН	Наноразмерные структуры на основе триглицина, сформированные из тонкой пленки на кремниевых подложках под действием органических соединений
Новак А. В., НИУ "МИЭТ"	Использование образца поликристаллического кремния с полусферическими зернами (HSG-Si) для оценки остроты иглы кантилевера
Сафарзаде А. А., НАА	Методы атомно-силовой микроскопии для исследований локально окисленных образований
Сдобняков Н. Ю., ТвГУ	О фрактальных свойствах наноразмерных пленок никеля, меди, хрома и титана: сравнительное исследование
Селезнева Е. В., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Роль катионного замещения в стабилизации суперпротонных фаз в кристаллах
Семенова Е. М., ТвГУ	Определение микромагнитных параметров одноосных ферромагнетиков по данным магнитно-силовой микроскопии
Семенова Е. М., ТвГУ	Применение аппарата фрактальной геометрии к исследованию наноструктуры и коэрцитивности гетерогенных сплавов SmCoCuFeZr
Чайка А. Н., ИФТТ РАН	Формирование нанокристаллов серебра на поверхности Si(557)
Щербакowa Е. Н., БНТУ	Исследование липосом с тенекеплазой методом АСМ
Югай С. М., ИХФП АН РУз	Исследование композиций гидроксиапатита хитозана атомно-силовой микроскопией

Стендовые доклады секции 4. Электронно-лучевая и ионная литографии

Курганов И. Г., ИПТМ РАН	Система позиционирования электронного пучка в электронном литографе
Румянцев А. В., Национальный исследовательский университет «МИЭТ»	Особенности распыления диоксида кремния при бомбардировке фокусированным пучком ионов галлия
Савицкая Т. Н., ИПТМ РАН	Повышение разрешающей способности электронно-оптических систем (ЭОС)
Уткин Д., ИФП СО РАН	Формы частиц Ge и Si созданных на поверхности SiO ₂ методами электронной и обратной литографии

Стендовые доклады секции 5. Электронно-лучевые технологии в микроэлектронике

Князев М. А., ИПТМ	Электрические свойства графеноподобных пленок, селективно выращенных на предварительно облученных низкоэнергетичными электронами подложках Si/SiO ₂ <i>Максим Князев, Дарья Седловец, Олег Солтанович и Сергей Ковешников</i>
Привезенцев В. В., ФГУ "ФНЦ НИИСИ РАН"	Исследования кварца, имплантированного Zn, для применения в мемристорах
Шакирова А. А., ФТИ им. А.Ф. Иоффе	Исследование передачи энергии возбуждения от тербия к европию в керамике на основе кубического ZrO ₂

Стендовые доклады секции 6. Рентгеновская кристаллооптика

Дрмеян Г. Р., ИППФ НАН РА	Экспериментальное исследование тонкой структуры рентгенодифракционных картин, полученных от двухблочных кристаллических систем с недифрагирующей зоной
Иванов И. В., НГТУ	Модифицированные методы профильного анализа результатов дифракции синхротронного излучения для анализа дефектной структуры поликристаллических твердых тел
Мехрабова М. А., Институт Радиационных Проблем НАНА	Влияние γ -излучения на кристаллическую структуру эпитаксиальных пленок $Cd_{1-x}Mn_xSe^I$
Рощин Б. С., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Устройство монохроматора для характеристики параметров двумерных энергодисперсионных рентгеновских детекторов
Скандаков Р. Н., ФМИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН	Определение оптических постоянных в области резонансного фотопоглощения на примере фуллерита C ₆₀

Стендовые доклады секции 7. Многослойная оптика для рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазона

Мохов Д. В., Алферовский университет	Сглаживание профиля и полирование поверхности рентгеновской дифракционной Si-решетки треугольного профиля
Плешков Р. С., ИФМ РАН	Синтез и изучение свойств многослойных зеркал Cr/Be для диапазона жесткого рентгеновского излучения

Стендовые доклады секции 8. Применение рентгеновской оптики для исследования микро- и наноструктур

Бусаров А. С., ФИАН	Оптические преобразования с нормально и наклонно расположенными объектами
Можчиль Р. Н., ИФТТ РАН	Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия молекулярных металлокомплексов порфиринов с металлами с различными заполненными f оболочками

Стендовые доклады секции 9. Рентгеновская микроскопия и томография

Дьячкова И. Г., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Рентгено-дифракционные исследования дислокационных структур в монокристаллическом кремнии
Золотов Д. А., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Формирование двойного изображения в полихроматическом излучении в лауэ-геометрии дифракции
Кривоносов Ю. С., ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН	Определение морфологических параметров пористых керамических мембран методом рентгеновской микротомографии
Попов Н. Л., ФИАН	Птихография

Стендовые доклады секции 10. Новые методы исследования микро- и наноструктур с использованием синхротронных и лабораторных источников рентгеновского излучения

Скоркин В. , ИЯИ РАН

Исследование металл-полимерных композитов с помощью лабораторных источников рентгеновского и бета излучений